7.3.2　JIS素案作成に向けた検討

(4) 光トランシーバのウィグル試験方法のJIS化支援

(a)これまでの経緯

2014年度から，今後JISとしても制定が必要な光能動部品の洗い出しの調査を開始し，2015年度にIEC 62150-3に規定している光トランシーバの試験及び測定方法（通称，ウィグル試験方法）について，JIS化の検討を行うことを決定した。

2016年度までにIEC 62150-3 Ed.2 を基礎として，JIS C 5954-5　「光伝送用能動部品-試験及び測定方法-　第5部：光トランシーバのレセプタクル部の機械的外乱（ウィグル）による光出力変動」として技術的内容が一致するようにJIS素案を作成した。通信業界においては，この試験方法を「ウィグル試験」と呼ぶのが通例であり，ウィグルとは，本文3.1.1で機械的な外乱と定義しているので表題に追加した。JIS素案においては，極力用語を統一するように努めた。また特殊な専門用語には補足説明をつけることとした。例として，LOS(loss of signal)を「入力信号断」とし「設定した受信信号のしきい値レベルを下回った状態」と補足説明を追加した。

2017年度には文章の推敲および図面の整備を行い，JIS素案を完成させた。またJIS原案作成概要調査書を作成し，2018年1月16日に経済産業省のヒアリングを受けた。

2018年度には日本規格協会による様式調整を受け，指摘事項についての修正を行ったのち，2019年2月15日に平成30年度区分Aの成果物として提出した。

(b)今年度の検討

前年度提出のJIS素案に対するJSAによる原案校正の後，2019年7月10日に申出が完了した。しかしその後「試験」，「測定」の用語の使い方について再度検討すべきとの意見が出て，箇条4の「測定」は「試験の概要」に変更し，合わせて本文中の数か所の「測定」を「試験」に変更あるいは省略すること，解説も本文に即して変更することとした。8月8日に上記変更に関する差替えが完了し，11月20日に公示された。